This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55—32026

DInt. Cl.3 G 02 F 1/133 G 09 F

9/35

識別記号 102

庁内整理番号 7348-2H 7013-5C

砂公開 昭和55年(1980) 3月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

50液晶表示パネル

0)特

願 昭53-104210

22出 昭53(1978) 8 月25日

仰発 明 者 小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 細川稔

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

加発 明 者 矢澤悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

明 者 永田光夫 仰発

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

人 株式会社諏訪精工舎 の出 願

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

発明の名称 液晶表示パネル

特許請求の範囲

(1) 表示セルを構成する一方の基板に、複数個 の能動業子及び受動業子をマトリックス状に配像 した半導体基板を用いた液晶表示パネルにおいて、 該半導体基板は表面平坦化処理が施された基板表 面上に該能物案子及び受動器子に対応してマトリー ツクス状に電板膜が形成されておりかつ該半導体 基板表面は配向処理膜にて獲われていることを特 徴とする液晶パネル。

(2) 半導体基板表面の表面平坦化処理は、凹凸 の娘しい半導体基板上に、1~54の膜厚にてワ ニス状の絶縁材料を塗布形成して成ることを特徴 とする特許精束の範囲第1項記載の液晶表示パネ

(3) 半導体基板装面の配向処理模は810の傾め ※ 驀着膜であることを特徴とする特許請求の範囲第1

項配敵の液晶炭示パネル。

(4) 液晶要示パネル内の液晶は、ねじれネマチ ツク構造を有することを特徴とする特許病求の範 囲祭1項配載の液晶表示パネル。

(5) 液晶器示パネル内の液晶は、多色性染料と オマチツク液晶とから成ることを特徴とする特許 請求の範囲第1項配載の液晶表示パネル。

発明の評細な説明 ...

- 本発明は液晶表示パネルに関するものである。 さらに本発明は、表示セルを構成する一方の基板 に用いた半導体基板の表面形状及び 袋面処理に関 するものである。

厳近、表示装備の進歩には目を見はるものがあ る。中でも液晶を用いた表示装性は、低電圧駆動 低電力、薄型及び長舞命と非常に多くの利点があ り、今日、腕時計、電卓を始め各権装置の表示装 世に用いられている。一方液晶表示装成の上述し たメリットを生かしてキャラクターディスプレイ 夢あるいはテレビ等へのアプリケーションも行なか れている。この様にマトリックス表示の行数及び 列数が多くなつた場合、表示セルを構成する一方 の基板に判導体基板を用い該基板上に配置された 能動業子により液晶をスタティック駆動する方式 が有効である。本発明は、このスタティック駆動 型液晶表示体装置に関するものである。

である。13は OVD 810。 膜、14はアルミニ ウム膜で電極と配線を成す。15は保護機であり 通常はOVD 810: 膜である。 第2図のA助がト ランジスター部、 B 部がコンデンサー部である。 第2図から明らかな如く、通常の工程にて半導体 基板を製造した場合、半導体基板表面は 1 ~ 5 μ 程度の段差が生じる。これは、半導体基板に組み 込まれる素子の形状及び製造プロセスによつても 若干異なるが一般に、その畏面の凹凸は大きい。 したがつて、第2図にて示した様子凹凸の敷しい 半導体基板を用いて、その表面に、810 等の傾 め蒸着により配向処理を施した場合、第3図に示 す如く、 B10 膜が形成される表面と、 B10 膜 が形成されない表面が生ずる。第3図中16は表 面に凹凸がある半導体基板、17は、角度が5 70~89° にて傾め蒸着される 810 粒子の蒸 着方向、18は、半導体基板上に形成された810 膜である。図からも明らかな如く、半導体基板 16 形成される表面の占める割合は少なくなる。第3

るため傾め蒸着膜20は、全面に付着する。一方 半導体板基板を用いる場合、半導体基板は、前述 した如く、表面の段差は1.0 4以上にもかり、仮 りに1.0 μの段差があつた場合、その表面80° の角度から傾め蒸着すると、段差部の片側 5.8 μ の領域には頃の蒸着膜が形成されないことになる。 本発明は、この点を解決するために発明されたも のでありコントラストが高くかつ見やすい表示パ ネルを実現したものである。具体的には半導体券 板表面が表示に帰与する領域の表面を平坦化し、 傾め蒸着を行なう際、段差によつて、傾め蒸着模 が付着しない領域の占める割合を低被したところ に特徴がある。第5回は、半導体基板の表面段差 を少なくした基板断面構造図である。第5図中の 7~14までの番号は、第2図中の番号と対応し ている。第5図中の21は、本発明のポイントで ある所の半導体基板表面を平坦にするための層で ある。また該備21上には液晶駆動電極として、 透明導電膜階もしくは金属層22が形成される。 この液晶収動電極は、スルーホールにより下部配

譲14と袋続されている。半導体基板表面を平坦 化する層21は、ポリイミド樹脂。低酸点ガラス あるいはその他の絶殺材がよい。ポリイミド資脂 の場合は、ポリイミドワニスとスピンナー塗布化 より半導体基板の表面に約1~5μの厚さにポリ イミド襲を形成する。この場合下地とポリイミド 膜との密着性を高めるために、シランカップリン グ朝をあらかじめ下地半導体基板に塗布してない てもよい。その後350~550℃の温度化てキ ユアする。スルーホールは、ヒドラジン液か NaOH 液にてホトエッチングすればよい。その茯、液晶 駆動用電種を形成すればよい。ポリイミドを、半 導体基板の平坦化材料として用いることは、ポリ イミドは、有機歯脂の中では患も耐熱性に優れ、 かつ膜厚が10ヵ程度までクラックが生じること なく形成出来、パツシペーション効果も優れてい る点で非常に有用である。しかし、本発明は、ポ リィミト被膜化限るものではなく、低触点ガラス 例えば、PDOsを主成分とした鉛ガラスでもよい し、Zn0gを主成分とした亜鉛ガラスでもよい。

本発明では半導体基板として主に M 0 8型のトランジスタを含む基板について説明して来たが本発明はこれに限るものではなく、エアエ (薄膜トランジスタ)を含む基板でもよいし、又、8 0 8 基板にも適用されることは言うに及ばない。又、半進体基板中には、能動素子だけが含まれていて

もよいし、又、受動素子だけが含まれていてもよいことも、もちろんである。 本発明の液晶表示セルを液晶表示テレビへ応用した場合、高いコントラストが与えられ、非常に有効である。この場合の液晶は、駆動質圧が低い、 ねじれネマチック型 液晶でもよいし、又、ネマチック液晶に 2 色性染料を混合した液晶でもよい。いずれにしろ、 要面が平坦化された半導体基板を用いることにより液晶の厚さが均一化出来ることもあり、コントラストの向上が期待出来る。

本発明は、上述した如く、液晶表示パネルのコントラストを高めるために、表示パネルの一方の 基板に用いた半導体基板の表面を平坦化処理した ことを特徴とする液晶表示パネルに関するもので あり、コントラストの向上が期待出来るものであ

図面の簡単な説明

第1回は液晶表示セルの断面構造を説明する図。 第2回は従来の半導体基板の表面凹凸状態を示 ナ断面構造図。

第3図は表面凹凸が激しい基板への配向処理を 示す図。

第4回は表面が平坦をガラス上への配向処理を 示す図。

第5図は本発明による表面が平坦化された半導体基板を示す断面構造図。

第6図は本祭明による袋面が平坦化された基板への配向処理を示す図。

1 … 半導体基板

2 … 液晶剧動電極

5 … 上側 ガラス 板

4 … 透明導電膜

5 …スペーサ

6 … 液晶

7 … ュ型シザコン基板

8 ··· p + 型拡散層

9 … n + 型拡散層

10…フィールド酸化膜

11…ゲート酸化膜

12…ドープドポリシリコン膜

1 3 ··· CVD S10: 膜

1 4 ··· 第 2 層配線 1 5 ··· CVD 810 g 膜

16…凹凸の激して半導体基板

1 7 … 領め蒸着方向 1 8 … 傾め蒸着膜

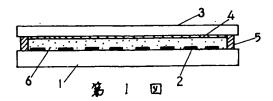
1 9 … ガラス板 2 0 … ほめ蒸着

2 1 … 半導体表面を平坦化する層

22…放品取物電板

2 5 … 表面が平坦化された半導体基板

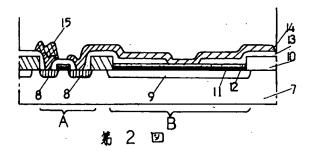
2 4 …液晶影動電極

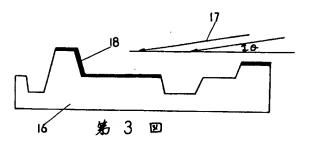


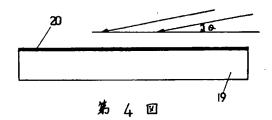
以上

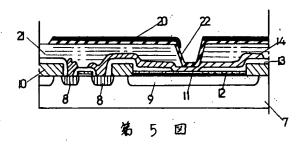
出願人 株式会社 龍 訪 精 工 会

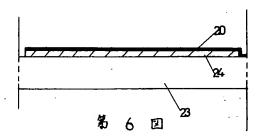
代理人 章 上 高











JAPAN PATENT OFFICE (JP)
PATENT APPLICATION PUBLICATION
PATENT PUBLICATION OFFICIAL REPORT (A)
SHO55-32026

Int. Cl. 3 G 02 F 1/133, G 09 F 9/35

IDENTIFICATION NUMBER: 102

IN-OFFICE SERIAL NUMBER: 7348-2H, 7013-5C

PUBLICATION: March 6, 1980 THE NUMBER OF INVENTION: 1

INSPECTION CLAIM, NOT CLAIMED, (total 4 pages)

1. Title of the Invention: Liquid crystal display panel Patent Application Sho 53-104210 Application August 25, 1978

2. Inventor(s)

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Oguchi KOICHI

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Minoru HOSOKAWA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Satoru YAZAWA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi

Suwa Seiko-sha

Name: Mitsuo NAGATA

3. Applicant

Address: 4-3-4, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Name: Suwa Seiko-sha Co., Ltd.

4. Attorney

Patent attorney: Tsutomu MOGAMI

SPECIFICATION

- 1. Title of the Invention
 Liquid crystal display panel
- 2. Scope of Claim for Patent

5

10

15

2.0

- 1. In a liquid crystal display panel utilizing a semiconductor substrate provided with a plurality of active elements and passive elements, said liquid crystal panel characterized in that said semiconductor substrate is provided with electrode films in a matrix form corresponding to said active elements and said passive elements over a surface of the semiconductor substrate, which surface has been planarized, and a surface of said semiconductor substrate is covered with an orientation treatment film.
- 2. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the planarized surface of the semiconductor substrate is formed by coating an insulating material in varnish form at a film thickness of 1 to 5μ on the semiconductor substrate having big irregularity.
- 3. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the orientation treatment film on the surface of the semiconductor substrate is an oblique evaporation film of SiO.
- 4. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the liquid crystal has a twisted nematic structure.
- 5. The liquid crystal display panel of claim 1, wherein the liquid crystal comprises polygenetic color and nematic liquid crystal.

e i

"Detailed Description of the Invention"

5

10

15

20

25

3 O °

3 5

40

The present invention relates to a liquid crystal display panel. Further, the present invention relates to a surface configuration and a surface treatment of a semiconductor substrate which is utilized for one of substrates constituting a display cell.

Recently, the display device is extremely advanced. Especially, the display device using liquid crystal has many advantages of low voltage driving, low power, thin type and long life. In these days, it is utilized for various kinds of display devices such as wristwatch, pocket calculato r. On the other hand, as a practical uses, the display device is applied for character display and television by making the best use of the above mentioned advantages of the liquid crystal display device. In this way, in case that the number of rows and columns of matrix display is big, it is effective to statically drive a liquid crystal utilizing active elements, which are prepared on a semiconductor substrate as one of the substrates constituting the display cell. The present invention relates to this static drive type liquid crystal display device.

Fig. 1 shows a conventional liquid crystal display panel. Fig. 1 shows a structural drawing of the conventional liquid crystal display panel. Reference numeral 1 in the figure shows a semiconductor substrate comprising active elements or passive elements. A liquid crystal driving electrode 2 is prepared on a surface of a semiconductor substrate in a form of matrix. Reference numeral 5 shows a spacer, and a transparent conductive film 4 is formed on an upper side glass plate 3. numeral 6 shows a liquid crystal. Fig. 2 shows a cross sectional drawing of a semiconductor substrate. In Fig. 2, a region enclosed with two dot chain line equals to one pixel. One transistor and one condenser are included in one pixel. In the figure, reference numeral 7 shows, for example, a n-type silicon substrate, 8 shows a p-type diffused layer, 9 shows a n+ type diffused layer, 10 shows a field oxide film, 11 shows an SiO₂ film, 12 shows a doped polysilicon film, and 13 shows a CVD SiO₂ 14 is an aluminum film comprising electrode and wiring. 15 is a protective film, which is usually a CVD SiO2 film. In Fig. 2, the part A is a transistor and the part B is a condenser. As apparent from Fig. 2, in case that the semiconductor substrate is manufactured by a conventional process, a step of approximately 1 to 3 μ is formed on the surface of the semiconductor substrate. The unevenness of the surface is generally large although it depends slightly upon the configuration of the elements embedded in the semiconductor substrate and the manufacturing proces Therefore, as shown in Fig. 2, when an orientation treatment is

conducted on the surface of the semiconductor substrate having big irregurality by oblique evaporation of SiO or the like, there is formed one surface on which the SiO film is formed and another surface on which no SiO₂ film is formed as shown in Fig. 3. In Fig. 3, 16 is the semiconductor substrate having irregularity on the surface thereof. 17 is a direction of evaporation of SiO particles which are deposited by an oblique evaporation at an angle $\theta = 70$ to 89°C and 18 is an SiO film formed on a semiconductor substrate. As apparent from the figure, the bigger the irregurality formed on the surface of the semiconductor substrate 16 is, the smaller the proportion of the surface having the SiO film formed thereon is. If a proportion of the surface having no SiO film is large, this part does not contribute to the actual display. Therefore, the contrast extremely reduces and the function as a display device deteriorates. present invention removes the defect of the conventional liquid crystal display panel. Referring to the detail examples, the object of the present invention will be set forth in the description.

5

10

15

20

2.5

30

35.

4 O:

Usually, the surfaces of two substrates constituting the liquid crystal display panel needs to be treated with a horizontal orientation or vertical orientation treatment depending upon the display mode and the kind of There are many methods as an orientation treatment, the liquid crystal. for example, rubbing process, oblique evaporation, and dipping method using such as silane coupling agent. However, in view of characteristic and homogeneous quality, oblique evaporation process is best. In the oblique evaporation method, SiO or Teflon is evaporated on the substrate in vacuum at an angle of 70 to 89° and thin and long lines are innumerably formed at intervals of several hundreds to several thousands Å(angstrom) on the surface of the substrate in order to conduct the orientation of the liquid crystal. In case of conducting oblique evaporation to glass substrate, an oblique evaporation film 20 is deposited on an entire surface because a surface of a glass plate 19 is flat as shown in Fig. 4. On the other hand, in case that a semiconductor substrate is used, a step of $1.0\,\mu$ or more is formed on a surface as mentioned above. If a semiconductor substrate having a step of 1.0 μ on the surface is subjected to an oblique evaporation at an angle of 80°, an oblique evaporation film is not deposited on a region of $5.8\,\mu$, at one side of the step portion. present invention has been made to solve the problem described above, thereby obtaining the display panel having high contrast and excellent image quality. Concretely, in case that the surface of the semiconductor substrate which contributes to the display is flatten and conduct an oblique evaporation, it characterized that a ratio of portion having no oblique evaporation film is reduced. Fig. 5 shows a cross-section al drawing of construction of a substrate having reduced a step on the surface of the semiconductor substrate. Reference numerals 7 to 14 in Fig. 5 corresponds to that in Fig. 2. Reference numeral 21 in Fig. 5 is a layer to flatten the surface of the semiconductor substrate, which is the point of the present invention. Further, as a liquid crystal driving electrode, a transparent conductive film layer or a metal layer 22 is formed on the layer 21. The liquid crystal driving electrode is connected with a lower wiring 14 by through hole. The layer 21 which flattens the surface of the semiconductor substrate may comprise polyimide resin, glass having low melting point, insulating material, or the like. that a polyimide resin is used, a polyimide film having a thickness of 1 to 5μ on the surface of the semiconductor substrate by polyimide varnish and spinner application. In this case, silane coupling agent is applied to a base semiconductor substrate to enhance the adherence between the Subsequently, it is cured at a base film and a polyimide film. temperature of 350 to 550°C. Through holes may be formed by photoetching by using hydrazine solution or NaOH. Then, a liquid crystal driving electrode may by formed. Polyimide is used as a flattening material for the semiconductor substrate because it is superior in heat resistance to other organic resins and it can be formed at a thickness of 10 μ without crack. Furthermore, polyimide is superior in passivation the present invention is applied to not only a However, polyimide film but also a glass having low melting point, for example, a lead glass comprising PbO2 as a main component, a zinc glass comprising ZnO₂ as a main component or a phosphorus glass comprising P₂O₅ as a main component. If a step of 0.5μ or less is formed on the surface of the semiconductor substrate after deposition, the above mentioned materials can be sufficient for the present invention. By an oblique evaporation, an orientation film is formed on a surface of the flatten semiconductor formed by the above mentioned process. Thereby, as shown in reference numeral 20 in Figs. 5 and 6, almost all display portions can be treated with an orientation process, so that the contrast of the liquid crystal display panel is remarkably improved and it is possible to obtain a good image of the display panel. In Fig. 6, reference numeral 23 is a semiconductor substrate having a planarized surface, and 24 is a liquid crystal driving electrode. By using the semiconductor substrate having the planarized surface according to the present invention, contrast of the liquid crystal display panel is improved to several times as compared with conventional one.

5

10

15

20

25

30

35

10

In the present invention, the substrate having a MOS type transistor is

explained as a semiconductor substrate, however, a substrate having TFTs or a SOS substrate may be used as the semiconductor substrate. Moreover, a semiconductor substrate may be consisting of not only active elements but also passive elements. When a liquid crystal display cell according to the present invention is applied to the liquid crystal display television, it is very effective to obtain a high contrast. In this case, a liquid crystal may be a twisted nematic type having low driving voltage or a nematic liquid crystal is mixed with dichroism color. If a semiconductor substrate having a flatten surface is used, display having an improved contrast can be obtained because the thickness of the liquid crystal can be uniform.

As above mentioned, the present invention relates to the liquid crystal display panel, which is characterized that a surface of the semiconductor substrate used for one side of the display panel is planarized to improve the contrast.

"Brief Explanation of The Drawings"

5

10

15

20

25

30

35

Fig. 1 illustrates a cross sectional structure of a liquid crystal cell.

Fig. 2 is a cross sectional view showing an irregularity, which is formed on the surface of a conventional semiconductor substrate.

Fig. 3 shows an orientation treatment of a substrate having a big irregularity.

Fig. 4 shows an orientation treatment of a glass having a planarized surface.

Fig. 5 shows a cross sectional view of a semiconductor substrate having a planarized surface in accordance with the present invention.

Fig. 6 shows an orientation treatment of a substrate having a planarized surface.

1---semiconductor substrate 2---liquid crystal driving electrode 4---transparent conductive film 3---upper side glass plate 5---spacer 6---liquid crystal 8---p+ type diffused layer 7---n type silicon substrate 10---field oxide film 9---n+: type diffused layer 12---doped polysilicon film 11---gate oxide film 14---a second layer wiring 13---CVD SiO₂ film 15---CVD SiO₂ film and the state of t

16---semiconductor substrate having a big irregularity

17---oblique evaporation direction

18---oblique evaporation film 19---glass plate

20---oblique evaporation film

21---a layer to make a surface of semiconductor to be planarized

22---liquid crystal driving electrode

23---semiconductor substrate having a planarized surface

24---liquid crystal driving electrode

Applicant Suwa Seiko-sha Attorney Tsutomu MOGAMI

5